Search Notes



Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination	
10/671,115	ARQUIE ET AL.	
Examiner	Art Unit	
TuyetLien (Lien) T. Tran	2179	

SEARCHED					
Class	Subclass	Date	Examiner		
715	734	1/3/2007	т		
715	736	1/3/2007	π		
715	737	1/3/2007	. 17		
715	738	1/3/2007	π		
345	440	1/3/2007	П		
709	224	1/3/2007	П		
715	735	1/3/2007	тт		
-					

INTERFERENCE SEARCHED					
Class	Subclass	Date	Examiner		
	/subclasses ove	1/3/2007	π		

SEARCH I (INCLUDING SEAR		·)
	DATE	EXMR
EAST search updated	1/3/2007	π
Consulted with Ba Huynh	12/15/2006	π
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
<u>. </u>		